

**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPAY ZEKA

YAPAY ZEKA UYGULAMARIYLA YANGIN TESPİTİ

ALİ EKEN

KOCAELİ 2020

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPAY ZEKA

YAPAY ZEKA UYGULAMARIYLA YANGIN TESPİTİ

ALİ EKEN

Prof.Dr. Bahadır Işık

Danışman, Kocaeli Üniv.

.....

Doç.Dr. Murat Karakurt

Jüri Üyesi, Kocaeli Üniv.

.....

Dr. Öğr. Ahmet Burhan Bulut

Jüri Üyesi, Kocaeli Üniv.

.....

Tezin Savunulduğu Tarih: 20.03.2018 / 2017-2018 Güz

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu tez çalışması,.....a
macıyla gerçekleştirilmiştir.

Tez çalışmamda desteğini esirgemeyen, çalışmalarına yön veren, bana güvenen ve yüreklendiren danışmanım sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmamın tüm aşamalarında bilgi ve destekleriyle katkıda bulunan hocam..... teşekkür ediyorum.

Tez çalışmamda gösterdiği anlayış ve destek için sayın..... teşekkürlerimi sunarım.

Hayatım boyunca bana güç veren en büyük destekçilerim, her aşamada sıkıntılarımı ve mutluluklarımı paylaşan sevgili aileme teşekkürlerimi sunarım.

Mayıs – 2018

Ali EKEN

Bu dokümandaki tüm bilgiler, etik ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilip sunulmuştur. Ayrıca yine bu kurallar çerçevesinde kendime ait olmayan ve kendimin üretmediği ve başka kaynaklardan elde edilen bilgiler ve materyaller (text, resim, şekil, tablo vb.) gerekli şekilde referans edilmiş ve dokümanda belirtilmiştir.

Öğrenci No: 170201025

Adı Soyadı: Ali Eken

Öğretim Türü: Örgün Öğretim

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR	i
İÇİNDEKİLER	ii
ŞEKİLLER DİZİNİ	iii
TABLolar DİZİNİ	iv
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	v
ÖZET	vii
ABSTRACT	viii
GİRİŞ	1
1. SAYISAL KORUMADA TEMEL KAVRAMLAR	3
1.1. Ayrık İşaretlerin Fazörel Gösterimi	3
1.2. Arıza Tipinin Belirlenmesi	6
2. İLETİM HATLARINDA EMPEDANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMALARI	12
2.1. Tek Bara Ölçümlerini Kullanan Arıza Yeri Bulma Algoritmaları.....	13
2.1.1. Basit reaktans algoritması	13
2.1.2. Takagi algoritması	13
2.1.3. Geliştirilmiş Takagi algoritması	14
2.2. İki Bara Ölçümlerini Kullanan Arıza Yeri Bulma Algoritmaları	14
2.1.1. Basit arıza gerilimi eşitliği algoritması	14
2.1.2. Asimetrik arıza yeri bulma algoritması	15
2.1.3. Negatif bileşenler ile arıza yeri bulma algoritması	16
2.1.4. Simetrik arıza yeri bulma algoritması	17
3. EMPEDANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMALARININ FARKLI TEST SİSTEMLERİNDE UYGULANMASI.....	20
3.1. Homojen Test Sistemi	20
3.2. Homojen Olmayan Test Sistemi	24
3.3. Homojen Olmayan Test Sistemi (Orta Uzun Hat Modeli - Pi Eşdeğer Devresi)	28
4. SERİ KAPASİTÖRLÜ İLETİM HATLARINDA ARIZA YERİ TESPİTİ	33
5. SERİ KAPASİTÖRLÜ İLETİM HATLARI İÇİN PERFORMANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMASI	37
5.1. Algoritmanın Temel Arıza Yeri Bulma Algoritmaları İle Karşılaştırması.....	41
5.2. Seri Kapasitörlü İletim Hatlarını Baz Alan Arıza Yeri Bulma Algoritmalarının Karşılaştırılması	45
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER.....	48
KAYNAKLAR	53
EKLER	59
KİŞİSEL YAYIN VE ESERLER	68
ÖZGEÇMİŞ	69

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1.1.	Yinelenen Fourier ifadesi	5
Şekil 1.2.	Simetrik bileşenlerin gösterimi a) pozitif bileşenler b) negatif bileşenler c) sıfır bileşenler	7
Şekil 1.3.	Şebekenin a) pozitif bileşen devresi b) negatif bileşen devresi c) sıfır bileşen devresi	8
Şekil 1.4.	Arıza öncesi, arıza anı ve arıza sonrası durum	9
Şekil 2.1.	İletim hattında arıza eşdeğer devresi	12
Şekil 3.1.	Homojen test sistemi	20
Şekil 3.2.	Homojen olmayan test sistemi	24
Şekil 3.3.	Homojen olmayan test sistemi(π modeli)	28
Şekil 5.1.	Seri kapasitörlü iletim hattı	37
Şekil 5.2.	Arıza yerinin S barası ve seri kapasitör arasında olma durumu	38
Şekil 5.3.	Performansa dayalı alınan algoritmanın akış diyagramı	41
Şekil 5.4.	Seri kapasitörlü test sistemi	42
Şekil 5.5.	MOV ve seri kapasitörde ki akım değişimi	43

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1.1.	Arıza tiplerine göre pozitif bileşen empedans eşitlikleri	10
Tablo 3.1.	Homojen test sisteminde farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	21
Tablo 3.2.	Homojen test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	23
Tablo 3.3.	Homojen olmayan test sisteminde farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	25
Tablo 3.4.	Homojen olmayan test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	26
Tablo 3.5.	Homojen olmayan test sisteminde (orta uzun hat modeli - π eşdeğer devresi) farklı uzaklıklardaki farklı arıza tipleri için yüzde hata oranları	29
Tablo 3.6.	Homojen olmayan π eşdeğer devreli test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları.....	30
Tablo 4.1.	Seri kompanzasyonun etkileri ve sonuçları	33
Tablo 4.2.	Seri kompanze edilmiş iletim sistemleri için kullanılan bazı algoritmalar ve özellikleri	34
Tablo 5.1.	Test sistemi parametreleri	42
Tablo 5.2.	Test sisteminin simülasyon parametreleri	42
Tablo 5.3.	Test sisteminin farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları	44
Tablo 5.4.	Test sisteminin farklı arıza dirençlerindeki faz-faz-toprak arıza tipi için yüzde hata oranları	45
Tablo 5.5.	Seri kapasitörü dikkate alan algoritmaların karşılaştırılması	46
Tablo 5.6.	Seri kapasitörü dikkate alan algoritmaların genel özellikleri	47

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

$\alpha_{1,2,3}$: Eğim için alınan açı, (°)
φ	: Açıl, (°)
θ	: Açıl, (rad)
d	: Arıza noktasının referans baraya uzaklığı, (%)
d_{capS}	: Seri kapasitörün S barasına uzaklığı, (%)
d_{capR}	: Seri kapasitörün R barasına uzaklığı, (%)
d_S	: Arıza noktasının S barasına uzaklığı, (%)
d_R	: Arıza noktasının R barasına uzaklığı, (%)
f_0	: İşaretin frekansı, (Hz)
f_S	: Örnekleme frekansı, (Hz)
I^0	: Sıfır bileşen akımı, (A)
I^1	: Pozitif bileşen akımı, (A)
I^2	: Negatif bileşen akımı, (A)
I_a	: a fazı akımı, (A)
I_{ab}	: a fazı ve b fazı akımları farkı, (A)
I_b	: b fazı akımı, (A)
I_{bc}	: b fazı ve c fazı akımları farkı, (A)
I_c	: c fazı akımı, (A)
I_{ca}	: c fazı ve a fazı akımları farkı, (A)
I_{cap}	: Seri kapasitör üzerinden geçen akım, (A)
I_F	: Arıza noktasından geçen akım, (A)
I_{FR}	: Arıza noktasından geçen akımın R barasından gelen kısmı, (A)
I_{FS}	: Arıza noktasından geçen akımın S barasından gelen kısmı, (A)
$I_{\text{önce}}$: Arıza öncesi akım, (A)
I_R	: R barasından çıkan akımı, (A)
I_{ref}	: Alınan referans akım, (A)
I_S	: S barasından çıkan akımı, (A)
$I_{\text{süp}}$: Süperpozisyon akımı, (A)
$I_{\text{süp}}^*$: Süperpozisyon akımının eşleniği, (A)
R_F	: Arıza noktası empedansı, (Ω)
X_L	: Hat empedansının imajiner bileşeni, (Ω)
xd''	: Senkron makinenin subtransientreaktansı, (pu)
V^0	: Sıfır bileşen gerilimi, (V)
V^1	: Pozitif bileşen gerilimi, (V)
V^2	: Negatif bileşen gerilimi, (V)
V_a	: a fazı gerilimi, (V)
V_{ab}	: a fazı ve b fazı gerilimleri farkı, (V)
V_b	: b fazı gerilimi, (V)
V_{bc}	: b fazı ve c fazı gerilimleri farkı, (V)
V_c	: c fazı gerilimi, (V)
V_{ca}	: c fazı ve a fazı gerilimleri farkı, (V)
V_{cap}	: Kapasitör öncesindeki bağlantı noktasının gerilimi, (V)
V_R	: R barası (uzak bara) gerilimi, (V)
V_{ref}	: Alınan referans gerilimi, (V)

V_S	: S barası (yakın/referans bara) gerilimi, (V)
V_F	: Arıza noktası gerilimi, (V)
Z_{Cap-F}	: Seri kapasitör ile arıza noktası arasındaki empedans, (Ω)
Z_L	: Hat empedansı, (Ω)
Z_R	: R barasından görülen thevenin empedansı, (Ω)
Z_S	: S barasından görülen thevenin empedansı, (Ω)

Kısaltmalar

AC	: AlternativeCurrent (Alternatif Akım)
ANN	: ArtificialNeural Networks (Yapay Sinir Ağları)
DDA	: DeterministicDifferentialApproach (Deterministik Diferansiyel Yaklaşım)
FACTS	: FlexibleAlternativeCurrentTransmissionSystem (Esnek Alternatif Akım İletim Sistemi)
IEEE	: TheInstitute of ElectricalandElectronicsEngineers (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)
Im	: İmajiner
min	: Minimum
MOV	: Metal OxideVaristor (Metal Oksit Varistör)
PMU	: PhasorMeasurementUnit (Fazör Ölçüm Ünitesi)
R	: Receiving (Alan)
Re	: Reel
S	: Sending (Gönderen)
SC	: Series Capacitor (Seri Kapasitör)

YAPAY ZEKA UYGULAMARIYLA YANGIN TESPİTİ

ÖZET

"Yapay zekâ" kavramının geçmişi modern bilgisayar bilimi kadar eskidir. Fikir babası, "Makineler düşünebilir mi?" sorunsalını ortaya atarak makine zekâsını tartışmaya açan Alan Mathison Turing'dir. 1943'te II. Dünya Savaşı sırasında Kripto analizi gereksinimleri ile üretilen elektromekanik cihazlar sayesinde bilgisayar bilimi ve yapay zekâ kavramları doğmuştur.

Alan Turing, Nazilerin Enigma makinesinin şifre algoritmasını çözmeye çalışan matematikçilerin en ünlü olanlarından biriydi. İngiltere, Bletchley Park'ta şifre çözme amacı ile başlatılan çalışmalar, Turing'in prensiplerini oluşturduğu bilgisayar prototipleri olan Heath Robinson, Bombe Bilgisayarı ve Colossus Bilgisayarları, Boole cebirine dayanan veri işleme mantığı ile Makine Zekâsı kavramının oluşmasına sebep olmuştu.

Modern bilgisayarın atası olan bu makineler ve programlama mantıkları aslında insan zekâsından ilham almışlardı. Ancak sonraları, modern bilgisayarlarımız daha çok uzman sistemler diyebileceğimiz programlar ile gündelik hayatımızın sorunlarını çözmeye yönelik kullanım alanlarında daha çok yaygınlaştılar. 1970'li yıllarda büyük bilgisayar üreticileri olan Microsoft, Apple, Xerox, IBM gibi şirketler kişisel bilgisayar (PC Personal Computer) modeli ile bilgisayarı popüler hale getirdiler ve yaygınlaştırdılar. Yapay zekâ çalışmaları ise daha dar bir araştırma çevresi tarafından geliştirilmeye devam etti.

Bugün, bu çalışmaları teşvik etmek amacı ile Turing'in adıyla anılan Turing Testi ABD'de Loebner ödülleri adı altında makine zekâsına sahip yazılımların üzerinde uygulanarak başarılı olan yazılımlara ödüller dağıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Görüntü İşleme, Derin Öğrenme, Veri Bilimi

A NEW APPROACH FOR IMPEDANCE BASED FAULT LOCATION ON TRANSMISSION LINES

ABSTRACT

Purpose of this study is to examine impedance based algorithms on transmission lines for fault location and to develop a new algorithm for series compensated lines.

First of all, one and two end basic fault location algorithms are described. At a sample test system, results of the basic fault location algorithms are compared by changing system and fault related parameters. The system parameters consist of the line model and the cases of the system being homogeneous or nonhomogeneous while the fault related parameters are considered as fault type, fault location and fault resistance.

In the series compensated transmission lines, inadequacy of the basic impedance based fault location algorithms and necessity of a new particular fault location algorithm are shown by a simulation. The particular algorithms are analyzed and summarized. Then a new performance based algorithm is developed for the series compensated transmission lines in this thesis.

The developed algorithm iteratively estimates the fault location based on the calculated fault voltage and current using two end measurements and the line parameters, the algorithm can compare all the samples to attain a single outcome with minimal error. On the various test systems, the proposed algorithm is examined with two algorithm type, the basic algorithms and the particular algorithms designed for series compensated lines and the results are compared. The test systems are modeled and analyzed on DigSILENT and the gained current and voltage information is used in MATLAB for coded algorithms.

Keywords: Fault Location Algorithms, Transmission Lines, MOV, PMU, Series Capacitor.